

电子产品 可靠性与amp;环境试验

EPRET
1962年创刊

ELECTRONIC PRODUCT RELIABILITY AND ENVIRONMENTAL TESTING

中国电子学会可靠性分会
专业权威刊物

4

(双月刊)

第31卷总第184期

2013

ISSN 1672-5468
CN 44-1412/TN

主管/中华人民共和国工业和信息化部 主办/工业和信息化部电子第五研究所 协办/中国电子学会可靠性分会 全国电工电子产品可靠性和维修性标准化委员会

认证计量.试验检测.分析评价.数据服务.软件评测.信息安全



中国赛宝实验室
(工业和信息化部电子第五研究所)

ISSN 1672-5468



● 万方数据-数字化期刊群入网期刊
● 中国学术期刊综合评价数据库来源期刊
● 中国期刊网 中国学术期刊(光盘版)

● 中国核心期刊遴选数据库用刊
● 《CAJ-CD规范》执行优秀奖期刊
● 电子科技文献数据库 电子科技文摘用刊

● 中国期刊引证报告(扩刊版)
● 中国赛宝质量与可靠性网
● 广东省优秀科技期刊

目次

第 31 卷第 4 期
总第 184 期 (2013 年)

CONTENTS

Vol.31 No.4
Total No.184 (2013)

可靠性与环境试验技术及评价

- 一种评价印制电路板耐污染能力的试验方法 朱建华, 张樱蓝 (1)
- 房间空调器长效节能的一些影响因素分析 陈 军, 孙晓云, 张志刚, 肖诗满, 邹 伟 (7)

可靠性物理与失效分析技术

- 光敏晶体管漏电流变大的失效分析与控制 薄 鹏, 张 伟, 孟 猛 (11)
- ICP-OES 法测定焊料中铅的不确定度评定 杨文静 (14)
- PA 塑料中总卤含量测定实验室间比对分析 杨永兴, 杨文静 (18)

计算机科学与技术

- 基于 CAN 总线的直流老化电源信息化模型研究 胡洪江, 苏 萌 (23)
- 装备测试性建模与分析软件框架设计 方子豪 (27)
- 6 σ 质量工具云平台部署技术分析 葛智君, 潘 勇, 郭爱民 (31)
- 基于拉格朗日方程的 4-DOF 机器人运动分析 苏 萌 (36)

软件可靠性与评测技术

- 大型信息系统软件评价方法 徐思琰 (41)
- 机载相控阵雷达软件可靠性测评环境建设 云 雷 (45)

综述与展望

- 智能电表及其可靠性技术发展研究综述 张卫欣, 解 岩, 严晶晶, 李 蓓, 王有亮 (50)
- 无铅对电子产品可靠性的影响 鹿富丽, 周军连 (55)
- 动态故障树分析算法研究综述 段凌昊, 郭爱民, 潘 勇 (59)

电子元器件与可靠性

- 元器件降额准则分析 张皓东 (64)

计量与测试技术

- 基于 Verigy 93000 的 GMH 92 LV 18 全参数测试技术 王 勇, 罗宏伟, 蔡志刚 (68)
- 凸轮轴组件压装角检测与测量不确定度分析 芦秀红, 郭莹莹, 刘景玉 (72)

可靠性与环境适应性理论研究

- 无失效数据的加速寿命试验可靠性参数 Bayes 估计 陈 波, 王小强, 邓传锦 (77)

电子、电路设计与应用

- 用于芯片测试的环路滤波器设计 唐 锐 (81)

可靠性与环境适应性标准信息与行业动态

- 云计算时代如何确保信息安全 (6)
- 新研究揭示塑料半导体中电荷陷阱的形成机制 (10)
- 美军研制微波武器可让目标瘫痪产生灼痛感 (13)
- 未来两年云计算将成为第二大安全威胁 (17)
- 网络安全成为欧盟决策层的关注热点 (22)
- IBM 发布基于人脑的全新计算机架构 (26)
- 2012 年《电子产品可靠性与环境试验》增刊征订启事 (35)
- 2013 年《电子产品环境与可靠性试验》杂志增刊征文通知 (40)
- 全球最薄可弯曲有机发光二极管问世 (49)
- 可用石墨烯实现大功率半导体设备的大幅降温 (54)
- 美开发无缺陷半导体纳米晶体薄膜可用于新领域 (58)
- 白矮星磁场发现神秘原子键 助研新型量子计算机 (63)
- 2013 年云计算面临的九大安全威胁 (67)
- 欧盟公布网络安全战略 (71)
- 新型打印技术所得的薄膜导电性能优异 有望引领变革 (80)
- 本刊加入“中国知网 (CNKI)”等系列数据库的声明 (84)
- 第十届“国际可靠性、维修性、安全性会议(广州)”征文通知 (85)

征稿启事

投稿须知

订阅单

- A Test Method to Evaluate the Contaminant Resistant Ability of PCB ZHU Jian-hua, ZHANG Ying-lan (1)
- Factor Analysis on Long-Term Energy Saving of Room Air Conditioner ... CHEN Jun, SUN Xiao-yun, ZHANG Zhi-gang, XIAO Shi-man, ZOU Wei (7)
- Failure Analysis and Control Method of Photosensitive Transistor with Higher Leak Current BO Peng, ZHANG Wei, MENG Meng (11)
- Evaluation on Uncertainty of Measuring Lead in the Tin Solder by ICP-OES YANG Wen-jing (14)
- Analysis on Interlaboratory Comparisons of Determination of Halogen in PA Plastics YANG Yong-xing, YANG Wen-jing (18)
- Analysis on DC Aging Power Informatization Model based on CAN Bus HU Hong-jiang, SU Meng (23)
- Software Framework Design of Weapon System Testability Modeling and Analysis FANG Zi-hao (27)
- Technical Analysis on Deployment of Six Sigma Quality Box in Cloud Platform GE Zhi-jun, PAN Yong, GUO Ai-min (31)
- Motion Analysis of 4-DOF Robot Based on Lagrange Equation SU Meng (36)
- Evaluation Methods for Information System Software XU Si-yan (41)
- Airborne Phased Array Radar Software Reliability Testing Environment Construction YUN Lei (45)
- Reliability Technology Development of Smart Electricity Meter ... ZHANG Wei-xin, XIE Yan, YAN Jing-jing, LI Bei, WANG You-liang (50)
- Influence of Lead-Free on the Reliability of Electronic Products PANG Fu-li, ZHOU Jun-lian (55)
- Review on Dynamic Fault Tree Analysis DUAN Ling-hao, GUO Ai-min, PAN Yong (59)
- Analysis on Derating Criteria for Electrical, Electronic and Electromechanical Parts ZHANG Hao-dong (64)
- Full Parameter Testing Technology of GMH92 LV 18 on Verigy 93000 ... WANG Yong, LUO Hong-wei, CAI Zhi-gang (68)
- Analysis on Uncertainty of Testing and Measuring Camshaft Assembly Press-Fitting Angle LU Xiu-hong, GUO Ying-ying, LIU Jing-yu (72)
- Bayes Estimation of Reliability Index of Accelerated Life Test with Zero Failure Data ... CHEN Bo, WANG Xiao-qiang, DENG Chuan-jin (77)
- Design of Loop Filter Used in Chip Testing ... TANG Rui (81)